発信人 日本国特許庁 (国際調査機関)

•		
出願人代理人	AB JAN U 4, 2005	
宮崎 昭夫 様	Egy Comment	
あて名	PCT	
〒 107−0052	国際調査機関の見解書 (法施行規則第40条の2)	
東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビル8階	(PCT規則43の2.1)	
	発送日 (日. 月. 年) 28.12.2004	
出願人又は代理人 の書類記号 NEC04P175	今後の手続きについては、下記2を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP2004/014243 国際出願日 (日.月.年) 29.	優先日 09.2004 (日.月.年) 09.10.2003	
国際特許分類 (IPC) Int. Cl' H01L29/7	86, H01L27/06, H01L29/41	
出願人 (氏名又は名称) 日本電気株式会社		
1. この見解書は次の内容を含む。 ※ 第 I 欄 見解の基礎 第 I 欄 優先権 第 II 欄 優先権 第 II 欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解の不作成 第 IV 欄 発明の単一性の欠如 ※ 第 V 欄 P C T 規則43の2.1(a)(i)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 第 VI 欄 ある種の引用文献 第 VI 欄 国際出願の不備 第 VI 欄 国際出願に対する意見		
2. 今後の手続き 国際予備審査の請求がされた場合は、出願人がこの国際調査機関とは異なる国際予備審査機関を選択し、かつ、その国際予備審査機関がPCT規則66.1の2(b)の規定に基づいて国際調査機関の見解書を国際予備審査機関の見解書とみなさない旨を国際事務局に通知していた場合を除いて、この見解書は国際予備審査機関の最初の見解書とみなされる。		
	みなされる場合、様式PCT/ISA/220を送付した日かる期限が経過するまでに、出願人は国際予備審査機関に、適当 る。	
さらなる選択肢は、様式PCT/ISA/220を参照。	すること。	
3. さらなる詳細は、様式PCT/ISA/220の備考を	参照すること。	

見解書を作成した日 08.12.	2004	
名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP) 郵便番号100-8915	特許庁審査官(権限のある職員) 棚田 一也	4 L 9 3 6 1
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101	内線 3496

第 I 欄 見解の基礎		
1. この見解書は、下	記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎として作成された。	
この見解書は、		
	Eのために提出されたPCT規則12.3及び23.1(b)にいう翻訳文の言語である。	
2. この国際出願で開 以下に基づき見解	示されかつ請求の範囲に係る発明に不可欠なヌクレオチド又はアミノ酸配列に関して、 書を作成した。	
a. タイプ	配列表	
	■ 配列表に関連するテーブル	
b. フォーマット	一 	
	コンピュータ読み取り可能な形式	
c.提出時期	出願時の国際出願に含まれる	
	この国際出願と共にコンピュータ読み取り可能な形式により提出された	
	出願後に、調査のために、この国際調査機関に提出された	
3. さらに、配列表又は配列表に関連するテーブルを提出した場合に、出願後に提出した配列若しくは追加して提出した配列が出願時に提出した配列と同一である旨、又は、出願時の開示を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。		
4. 補足意見:		
,		

2. 文献及び説明

文献1: JP 2003-229575 A (株式会社日立製作所)

2003.08.15, 【0031】-【0042】段落, 図9-16

文献2: JP 2002-289871 A (株式会社東芝)

請求の範囲

2002.10.04, 【0016】-【0019】段落, 図1

文献3: JP 06-005856 A (川崎製鉄株式会社)

1994.01.14,【0010】-【0022】段落,図1-4

文献 4: JP 03-177072 A (富士通株式会社)

1991.08.01,第3図

文献 5: JP 2003-115551 A (松下電器株式会社)

2003.04.18,図1

文献 6: JP 10-178110 A (株式会社東芝)

1998.06.30, 図1

文献 7: M. ISHIDA, T. KAWAKAMI, A. TSUJI, N. KAKAMOTO, M. MOTOYOSHI,

N. OUCHI, 'A Novel 6T-SRAM Cell Technology Designed with

Rectangular Patterns Scalable beyond 0.18 µ m Generation and

Desirable for Ultra High Speed Operation',

IEEE International Electron Devices Meeting, 1998, page. 201-204

文献8: JP 08-298328 A (株式会社日立製作所)

1996.11.12, 【0016】-【0063】段落, 図1-3,

図6 - 31

請求の範囲1-8について

請求の範囲1乃至8に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至3に対 し進歩性を有さない。

文献1には、チャネルを形成する複数のフィンのソース/ドレイン領域に接続する「コンタクトホール220」内の電極の断面形状について記載がないが、文献2乃至3に記載されているように、半導体凸部のソース/ドレイン領域への接続方法として、半導体凸部に両側面から接触する構造は従来周知であり、文献1に記載の「コンタクトホール220」内の電極の断面形状として、該周知の構造を採用し本発明を構成することは当業者が容易に想到し得たことである。

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V.2 欄の続き

請求の範囲9について

請求の範囲9に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至4に対し進歩性 を有さない。

文献4に記載されているように、半導体凸部のソース/ドレイン領域の幅を広くした構造は従来周知の構造であり、文献1乃至3に記載の発明を実施する際に、該周知の技術を用いることは当業者が容易に想到し得たことである。

請求の範囲10について

請求の範囲10に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至8に対し新規 性及び進歩性を有する。

半導体凸部によりチャネルが形成された第1及び第2導電型トランジスタによりC MOSインバータを構成し、該第1及び第2導電型トランジスタの半導体凸部のドレイン領域を一の埋め込み導体配線により接続することは、文献1乃至8のいずれにも記載されておらず、また当業者にとって自明でもない。

請求の範囲11,15について

請求の範囲11及び15に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至3及び文献5乃至7に対し進歩性を有さない。

SRAM単位セルを構成するトランジスタの長手方向が第1方向に沿って配置され、各ゲート電極を構成する導体配線が第1の方向に垂直な第2の方向に配置される構造は、文献5乃至7に記載されるように従来周知であり、文献1乃至3に記載の技術を用いてSRAMを構成する際に、文献5乃至7に記載の構造を採用することは当業者が容易に想到し得たことである。

請求の範囲12-14について

請求の範囲12乃至14に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至8に対し新規性及び進歩性を有する。

半導体凸部によりチャネルが形成された複数のトランジスタによりSRAMを形成し、該複数のトランジスタの半導体凸部のソース/ドレイン領域を一の埋め込み導体配線により接続することは、文献1乃至8のいずれにも記載されておらず、また当業者にとって自明でもない。

請求の範囲16-18について

請求の範囲16乃至18に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至3に 対し進歩性を有さない。

文献1には、チャネルを形成する複数のフィンのソース/ドレイン領域に接続する「コンタクトホール220」内の電極の断面形状について記載がないが、文献2乃至3に記載されているように、半導体凸部のソース/ドレイン領域への接続方法として、半導体凸部に両側面から接触する構造は従来周知であり、文献1に記載の「コンタクトホール220」内の電極の断面形状として、該周知の構造を採用し本発明を構成することは当業者が容易に想到し得たことである。

補充欄

いずれかの欄の大きさが足りない場合

第 V.2 欄の続き

請求の範囲19, 21について

請求の範囲19及び21に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至3及び文献8に対し進歩性を有さない。

文献8にはソース/ドレイン領域とソース/ドレイン電極との間にエピタキシャル 層及び金属電極を介在させる技術が記載されており、文献1乃至3に記載の発明を実 施する際に文献8に記載の技術を適用することは当業者が容易に想到し得たことであ る。

請求の範囲20, 22について

請求の範囲20及び22に係る発明は、国際調査報告で引用された文献1乃至3に対し進歩性を有さない。

文献2にはソース/ドレイン領域表面をシリサイド反応させる技術が記載されており、文献1乃至3に記載の発明を実施する際に該技術を適用することは当業者が容易に想到し得たことである。